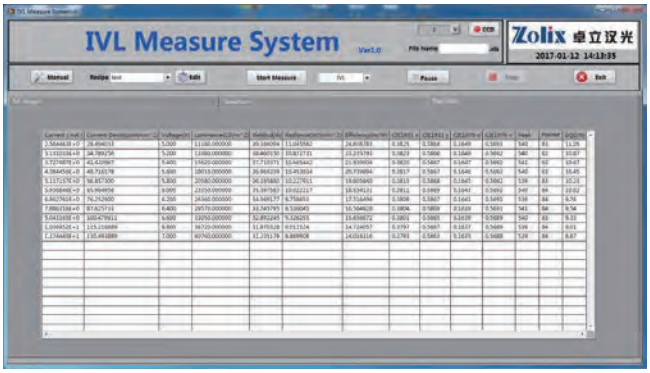
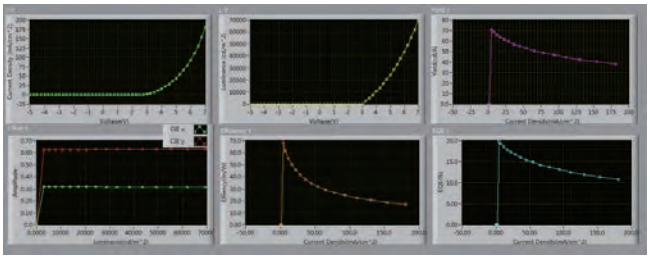
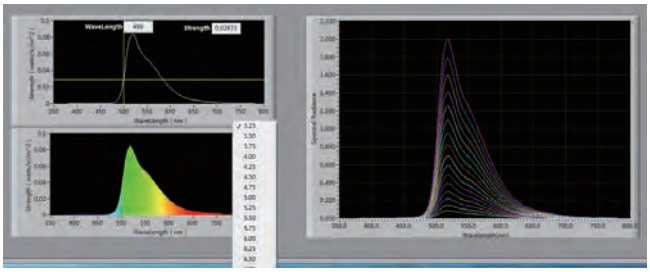
5. 光电显示自动光学测试系统

OLED IVL & EQE 测试系统

软件界面







此系统是专为 OLED 光电性能测试而研发，兼容 Keithley2400 系列，2600 系列源表，以及 Photo Research 全系列亮度计，再搭配手动或自动测试机台，专业定制化测试软件，即可实现单片或多片 OLED 器件 IVL 曲线，EQE 等光电参数的自动化测试；系统中还包括精确定位的 CCD 相机，可对 OLED 器件进行自动对焦和对位，省去手动对焦的繁琐。整套系统操作方便，软件和硬件均可按照客户实际需求进行定制，可以更好的满足客户的测试需求。

主要测试参数：

- IVL 曲线绘制：IV 曲线，电流密度，电流 - 亮度曲线，光效曲线，电流效率，流明效率
- 光学数据采集：亮度，XYZ 三刺激值，CIE 1931 色坐标 x,y，CIE1976 色坐标 u’ v’，峰值波长，光谱辐射度数据，CCT，EQE 等;
- 电学数据采集：电压，电流，功率等；